Anisotropic magnetoresistance effect in Fe_{4-x}Ni_xN films grown by molecular beam epitaxy

Weida Yin¹, Keita Ito¹, Takahiro Tanaka¹, Rie Y. Umetsu¹ (IMR, Tohoku Univ.¹)

[Introduction]

Anisotropic magnetoresistance (AMR) is a phenomenon whereby the resistivity of a material changes in response to the direction of an external magnetic field (H_{ex}). AMR represents a significant magnetoresistance effect and finds wide-ranging applications in fields such as magnetic sensors and magnetic storage. Fe₄N is an interesting ferromagnetic material showing negative AMR and the anomalous $\cos 4\theta$ term (C4) significantly increase at low temperature (T).¹⁻³⁾ AMR of Fe_{4-x}Ni_xN films with x = 1 and 3 have been reported, but the origin of C4 is still unclear.⁴⁾ In this study, Fe_{4-x}Ni_xN films with smaller incremental changes in x were fabricated and their AMRs were measured.

[Experiments]

The epitaxial Fe_{4-x}Ni_xN films were grown on MgAl₂O₄(MAO)(001) substrates at 450 °C by molecular beam epitaxy. Fe and Ni were supplied by electron beam gun and N was simultaneously supplied by radio-frequency plasma gun. The structures of the samples were characterized by reflection high-energy electron diffraction and x-ray diffraction. The Ni/Fe ratio, *x*, in Fe_{4-x}Ni_xN films was characterized by electron probe micro analyzer as x = 0, 0.6, 1.2, 1.6, and 2.2. The samples were microfabricated into a Hall bar shape, and AMR were characterized by using a physical properties measurement system. The sample was rotated under a steady H_{ex} of 3 T as shown in Fig. 1, and AMR was measured by four-probe method while changing the relative angle between H_{ex} and the current under different *T* of 6, 75, 200, and 300 K for all the sample.

Results

The Fe_{4-x}Ni_xN films were epitaxially grown on the MAO(001) substrates, but the uniform Fe_{4-x}Ni_xN phase was hard to form with the increase of Ni composition and started to decompose into FeNi at approximately x = 2.2. The relationship between *T* and AMR ratio (r_{AMR}) in the Fe_{4-x}Ni_xN films with different *x* is shown in Fig. 2. In the sample with x = 1.2, 1.6, and 2.2, the r_{AMR} value is positive at 300 K. In contrast, negative r_{AMR} is obtained at 300 K in the samples with x = 0 and 0.6. The absolute value of r_{AMR} gradually increased with the decreasing *T* and the sign of r_{AMR} of the samples with x = 1.2, 1.6, and 2.2 became negative. Particularly in the Fe₄N film, the $|r_{AMR}|$ rapidly enhanced to 9.8% at 6 K, which is much larger than the reported $|r_{AMR}|$ for Fe₄N films grown on MgO(001) and SrTiO₃(001) substrates.¹⁻³ The negative spin-polarization of density of states at the Fermi level (*P*) in Fe_{4-x}Ni_xN is reported.⁵ Considering a theoretical model reported in ref. 6, the combination of negative r_{AMR} and negative *P* obtained at low temperature region means that minority spin transport is dominant in the Fe_{4-x}Ni_xN films with *x* of 0 to 2.2. *T* dependence of *C*4 will be discussed in the presentation.

Reference

M. Tsunoda *et al.*, Appl. Phys. Express **3**, 113003 (2010). 2)K. Kabara *et al.*, Appl. Phys. Express **7**, 063003 (2014).
K. Ito *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. **51**, 068001 (2012). 4) F. Takata *et al.*, J. Appl. Phys. **121**, 023903 (2017). 5) F. Takata *et al.*, J. Appl. Phys. **120**, 083907 (2016). 6) S. Kokado *et al.*, J. Phys. Soc. Jpn. **81**, 024705 (2012).



Fig. 1 A schematic geometry of the transverse AMR measurement. Fig. 2 Temperature dependance of AMR ratio of Fe4-xNixN films.

Co基ホイスラーバルク単結晶の結晶方位を考慮した 異方性磁気抵抗効果の温度依存性

田中貴大、窪田崇秀*、古門聡士**、梅津理恵 (東北大金研、*東北大工、**静岡大総科技研)

Temperature dependence of anisotropic magnetoresistance effect considering crystal orientation of Co-based Heusler bulk-single crystals

T. Tanaka, T. Kubota^{*}, S. Kokado^{**}, R. Y. Umetsu

(IMR Tohoku Univ., ^{*}Grad. Sch. Eng. Tohoku Univ., ^{**}Grad. Sch. Integ. Sci. Tech. Shizuoka Univ.) はじめに

負の符号を示す異方性磁気抵抗効果(AMR)は、ハーフメタル型強磁性体(HMF)であることの必要条件とされ、簡易的にHMFの性質を評価する上で有用な手段であると理論的に示唆されている¹⁾。しかしながら、HMF となり得るホイスラー合金において結晶方位を考慮した AMR の報告例は限られており、ハーフメタル性と AMR の結晶方位依存性との関係を実験的に系統的に解明されることが望まれる。そこで、本研究では Co 基 ホイスラー合金のうち高いキュリー温度を有する Co₂MnGe および Co₂FeSi のバルク単結晶試料を用いて、三 次元的な結晶方位を考慮した AMR およびその温度依存性を報告する。

実験方法

バルク単結晶試料はブリッジマン法にて作製された。試料はラウエ回折パターンにより確認された特定の 結晶方位([100]、[110]、または[111])に沿って短冊状に加工した。その試料を 3T の定常磁場下で回転させ、磁 場と電流方向(結晶方位と平行)との相対角度を変化させながら四端子法にて6Kから300Kの温度範囲で測定 を行った。AMR 比は AMR_{θ} = ($\rho(\theta) - \rho_{\perp}$)/ $\rho_{\perp} \times 100$ (%)と定義される。ここで $\rho(\theta)$ は磁場と電流方向 との相対角 θ における観測された抵抗率を、 ρ_{\perp} は θ が 90 度の時の抵抗率を表す。

実験結果

Fig.1 に AMR 比の角度及び温度依存性の結果を示す。Co₂MnGe では、[100]・[110]・[111]の全方位で負の AMR が観測された。温度が 6 K から 300 K まで変化しても符号は変わらず、AMR 比の絶対値もわずかに増 加する程度であった。一方、Co₂FeSi では、[110]・[111]では負の AMR が、[100]では 6 K において正の AMR が観測された。また温度上昇に伴い、AMR 比の絶対値が低下した。なお、[100]・[110]における AMR の符号 の結果は、古門らが提案した結晶場効果を取り入れた s-d 散乱モデル²⁾との整合性が確認された。



Fig.1 Angle and temperature dependence of AMR ratio of (a) Co₂MnGe and (b) Co₂FeSi.

参考文献

- 1) S. Kokado, M. Tsunoda, K. Harigaya and A. Sakuma: J. Phys. Soc. Jpn., 81, 024705 (2012).
- 2) S. Kokado and M. Tsunoda: J. Phys. Soc. Jpn., 88, 034706 (2019).

量子アニーリングによる不規則性トンネルバリア設計

名和 憲嗣 ^{1,2}, 鈴木 健司 ³, 増田 啓介 ², 田中 宗 ^{4,5}, 三浦 良雄 ^{2,6} (三重大院工 ¹, 物材機構 ², TDK ³, 慶大理工 ⁴, 慶大 WPI-Bio2Q ⁵, 大阪大 CSRN ⁶) Quantum-annealing approach for designing cation-disordered spinels for magnetic tunnel junctions K. Nawa ^{1,2}, T. Suzuki ³, K. Masuda ², S. Tanaka ^{4,5}, and Y. Miura ^{2,6} (Mie Univ. ¹, NIMS ², TDK ³, Keio Univ. ⁴, WPI-Bio2Q, Keio Univ ⁵, CSRN, Osaka Univ. ⁶)

<u>はじめに</u>

第一原理計算と機械学習によるデータ駆動の材料開発,いわゆるマテリアルズ・インフォマティクス(MI) が急速に発展しており、材料を構成する元素種や組成比、規則性・不規則性などの様々な自由度を所望の物 性に合わせて最適化するための手法開発が多く行われている.最近では、組合せ最適化問題に特化した量子 アニーリング(QA)を用いた手法も提案され¹,この手法がベイズ最適化(BO)よりも優れた探索効率を示 し得ることが、Li バッテリー材料を例に示された²).本研究では、スピントロニクス材料に対する QA 法の 有用性を検証すべく、磁気トンネル接合素子(MTJ)の有望なバリア材料である逆スピネル MgGa2O4(MGO) に注目し、全エネルギー(*ΔE*Total)、トンネル磁気抵抗比(TMR)および素子抵抗(RA)に対するカチオン不 規則配列の最適化を試みた.

<u>解析方法·結果</u>

9 原子層の逆スピネル MGO を用いた Fe/MGO/Fe(001)-MTJ において,カチオンの Mg と Ga は八面体サイト を不規則に占有し、この不規則配列の組み合わせの数は 252 (= $_{10}C_5$)通りとなる.この中からランダムに選 んだ 20 構造に対して第一原理計算を行い ΔE_{Total} , TMR, RA の訓練データを作成し、機械学習の Factorization machine (FM) と量子アニーリングを組み合わせた FM+QA 法 ²⁾により、次候補のカチオン配列を予測した. 予測された MTJ 構造の第一原理計算と FM+QA 法による予測を繰り返し、各物性に対して最適な MTJ 構造 が得られるまでに必要な構造数を調べた ³⁾.

Fig. 1(a)の通り, FM+QA 法は, ΔE_{Total} と TMR を最適化するカチオン配列の探索には他手法 (FM+SA, BO, RS)

より優れた効率を示したが、RA の最適化にお いては BO が最も優れた探索効率を示した.よ って, FM+QA 法の優位性は目的とする物理量 に依存する結果が得られた. カチオン配列の特 徴を調べたところ、高 TMR (低 RA) を示す MTJ では Mg (Ga) が MGO 層の中央領域に集 中して分布していた. 第一原理計算の解析から, MGO 層の中央領域に Mg (Ga) が分布すること でバリア高さが高く(低く)なり、これが高 TMR (低 RA)の起源であることが分かった [Fig. 1(b), (c)]. 本研究は, TDK 株式会社, 科研費 (JP20H02190, JP20K14782, JP21H01750, JP21K03391, JP22H04966, JP22K14290, JP23H05447, JP23H05447), JST (JPMJPF2221), WPI-Bio2Qの助成を受けて行われた.



Fig. 1 (a) Searching efficiency for optimizing ΔE_{Total} , TMR, and RA with a comparison of FM+SA (simulated annealing), BO (Bayesian optimization), and RS (random search). (b) and (c) Local density of states projected on real-space MTJ structure showing the highest TMR and lowest RA.

参考文献

- 1) K. Kitai, et al., Phys. Rev. Res. 2, 013319 (2020).
- 2) K. Hatakeyama-Sato, et al., Adv. Intell. Syst. 3, 2000209 (2021).
- 3) K. Nawa, T. Suzuki, K. Masuda, S. Tanaka, Y. Miura (submitted).

29pB - 4

垂直磁化の導電性コバルトフェライト電極を用いた

磁気トンネル接合素子のトンネル磁気抵抗効果

田中 雅章, 市川 知幸, 眞下 大輔, 森下 雅也, 小見山 遥*, 本多 周太**, 小野 輝男*, 壬生 攻 (名工大工、*京大化研、**関西大シス理)

Tunnel magnetoresistance effect of magnetic tunnel junctions

using perpendicularly magnetized conductive cobalt ferrite electrodes

M. A. Tanaka, T. Ichikawa, D. Mashimo, M. Morishita, H. Komiyama, S. Honda, T. Ono, and K. Mibu (Nagoya Inst. Tech., *Kyoto Univ., ** Kansai Univ.)

はじめに

コバルトフェライト(CFO)は逆スピネル構造を持つフェリ磁性であり、面内方向の引っ張り歪みを受けた (001)配向の CFO 薄膜は大きな垂直磁気異方性を示す[1-2]。我々は Fe リッチの CFO 薄膜を作製するときの作 製条件を調整することで、Fe²⁺がほとんど存在しないため絶縁性を示す I-CFO (Insulative- Co_xFe_{3-x}O₄₊₆ (0<x<1)) と Fe²⁺と Fe³⁺が存在することで導電性を示す C-CFO (Conductive- Co_yFe_{3-y}O₄ (0<y<1))の垂直磁化膜を作り分 けができることを報告した[3]。また、絶縁性の I-CFO 薄膜のトンネル型スピンフィルター効果を使って 100 K で-28%の効率を示すスピン注入を観測した[4]。本研究では、第一原理計算から少数スピンを持つ電子が伝 導に支配的で高いスピン注入効率が期待できる導電性の C-CFO に注目し、垂直磁化を持つ C-CFO 薄膜を強 磁性電極とする非磁性層バリアの磁気トンネル接合(MTJ)素子を作製し、この MTJ 素子に対してトンネル磁 気抵抗(TMR)効果の測定を行うことで C-CFO 薄膜のスピン注入効率を評価した。

実験方法

パルスレーザー堆積法で MgO(001)基板上にバッファ層 I-CFO(20 nm)、MTJ 素子の下部強磁性電極 C-CFO (20 nm)、非磁性トンネルバリア層 MgO (2.5 nm)の順番で製膜した。その上に上部強磁性電極として Co(1.0 nm)/{Tb(0.45 nm)/Co(0.65 nm)}₁₅/Co(2.0 nm)または C-CFO(10 nm)/Pt(3.0 nm)の多層膜を作製し、それぞれ MTJ-1 と MTJ-2 とした。X 線回折装置で結晶構造と格子歪みの評価を行い、SQUID 磁束計を用いて磁化測定を行 った。またフォトリソグラフィーと Ar イオンミリングを用いて直径が数 μm の MTJ 素子を作製したのち、 膜面垂直方向に外部磁場を印加して磁気抵抗測定を行い、観測された TMR 効果からスピン注入効率を評価し た。

実験結果

MgO(001)基板上ではバッファ層の I-CFO と下部強磁性電極層の C-CFO は(001)方向にエピタキシャル成長 し、基板の影響を受けて面内方向の引張歪みが存在することがわかった。また、磁化測定から MTJ 素子用の 多層膜は下部・上部強磁性電極ともに垂直磁化を示し、C-CFO 層は垂直磁気異方性が誘起されていることが わかった。磁気抵抗測定から、MTJ-1 素子は 100 K において上下の強磁性層の磁化が反平行状態で抵抗値が 小さくなる-5%の負の TMR 効果が観測された。一方で MTJ-2 では 100 K において上下の強磁性層の磁化が 平行状態で抵抗値が小さくなる+6%の正の TMR 効果が観測された。第一原理計算から C-CFO では少数スピ ンを持つ電子が伝導に支配的で Co では多数スピンを持つ電子が伝導に支配的なため、C-CFO 層と Co 層を用 いた MTJ-1 では負の TMR 効果が観測され、上下の強磁性層に C-CFO 層を用いた MTJ-2 では正の TMR 効果 が観測されたと考えられる。以上のように、本研究では C-CFO 薄膜による垂直磁化方式のトンネル接合の作 製に成功した。MTJ-2 で観測された TMR 比からジュリエールの式で見積もられた C-CFO 層のスピン注入効 率は-3%であった。

<u>参考文献</u>

H. Yanagihara *et al.*, J. Appl. Phys. 109, 07D122 (2011).
J. Okabayashi *et al.*, Phys. Rev. B 105, 134416 (2022).
M. Morishita *et al.*, Phys. Rev. Mater. 7, 054402 (2023).
M. Tanaka *et al.*, Appl. Phys. Lett. 122, 042401 (2023).